

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination HEYNEKER ET AL.	
09/875,204		
Examiner	Art Unit	
Jan M. Ludlow	1743	

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
			-	
· .				
,				

INTERFERENCE SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
	<u> </u>				

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)			
	DATE	1	
updated search	10/1/200	07 JML	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	·		
		:	